



Evento	Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2018
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	Busca, recuperação e padronização de metadados de patentes: limitações e dificuldades
Autor	THIAGO MONTEIRO ALVES
Orientador	ANA MARIA MIELNICZUK DE MOURA

Busca, recuperação e padronização de metadados de patentes: limitações e dificuldades

Autor: Thiago Monteiro Alves

Orientador: Ana Maria Mielniczuk de Moura

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Demonstra as dificuldades e limitações encontradas na busca, recuperação e padronização de metadados de patentes coletadas na base de dados Derwent Innovations Index (DII), de propriedade da empresa Clarivate Analytics e que pode ser acessada, mediante assinatura, pelo Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta base é considerada mundialmente, uma das mais importantes base de dados que indexam patentes. É um estudo de natureza básica, abordagem quali-quantitativa, com objetivo descritivo e utiliza-se de procedimentos patentométricos para contemplar os objetivos do trabalho. Serviu como base para a pesquisa "Interação entre produção tecnológica e científica: panorama das patentes e artigos dos pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Química da UFRGS", projeto de mestrado da aluna Ana Paula Medeiros Magnus, vinculado ao projeto "Interação entre Ciência e Tecnologia em artigos e patentes no Brasil", coordenado pela Prof^a. Ana Maria Mielniczuk de Moura. Este estudo foi fruto do auxílio prestado pelo autor na busca, recuperação e padronização de dados para a pesquisa citada. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Os registros foram recuperados a partir de estratégias de busca elaboradas com as diversas variações possíveis do nome e sobrenome dos pesquisadores estudados. Para a confirmação dos dados coletados na DII, foi realizado uma conferência dos registros obtidos através do Instituto Nacional de Propriedade industrial (INPI) e do Currículo Lattes de cada pesquisador, para constatar a veracidade das informações recuperadas. Como conclusões, podemos constatar que a DII não indexa todas as patentes publicadas pelo INPI, demonstrando inconsistência das informações contidas na base. Além disto, há uma grande dificuldade de confirmar os registros de autoria das patentes pois a base não possui uma padronização que permita discernir fielmente os autores. Percebe-se por fim, a importância e necessidade de se estudar profundamente as bases de dados que publicam patentes, a fim de compreender suas coberturas, formas de indexação, recuperação, apresentação e padronização dos dados para que possam ser utilizadas como ferramentas em pesquisas acadêmicas.

Palavras-chave: Patentes. Patentometria. Busca e Recuperação de Informação. Padronização.